

24.12.2004

日本特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2003年12月26日

出願番号
Application Number: 特願2003-431939

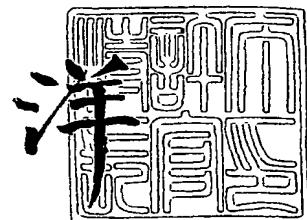
[ST. 10/C]: [JP2003-431939]

出願人
Applicant(s): 株式会社フューチャービジョン
大見忠弘

2005年2月3日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

八 川



【書類名】 特許願
【整理番号】 JPPFV0003
【提出日】 平成15年12月26日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 H01L 21/304
【発明者】
 【住所又は居所】 宮城県仙台市青葉区米ヶ袋2丁目1-17-301
 【氏名】 大見 忠弘
【発明者】
 【住所又は居所】 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森1丁目25-21
 【氏名】 平山 昌樹
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都港区赤坂五丁目3番6号 TBSセンター 東京エレクトロン株式会社内
 【氏名】 堀口 貴弘
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都港区赤坂五丁目3番6号 TBSセンター 東京エレクトロン株式会社内
 【氏名】 廣江 昭彦
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都港区赤坂五丁目3番6号 TBSセンター 東京エレクトロン株式会社内
 【氏名】 北村 昌幸
【特許出願人】
 【識別番号】 502266320
 【氏名又は名称】 株式会社フューチャービジョン
【特許出願人】
 【識別番号】 000205041
 【氏名又は名称】 大見 忠弘
【代理人】
 【識別番号】 100094651
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 大川 晃
【選任した代理人】
 【識別番号】 100123478
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 田邊 隆
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 089234
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1

【書類名】特許請求の範囲**【請求項1】**

マイクロ波を用いて線状プラズマを形成し、被処理物表面を前記線状プラズマに水平に保ちつつ被処理物の移動中に大気圧下またはその近傍の圧力下で処理を被処理物に施すマイクロ波プラズマ処理方法において、

プラズマヘッドにH面スロットアンテナを備え、該スロットアンテナのスロットを $\lambda_g/2$ のピッチで導波管の中心線を挟んで交互に形成し、かつ、前記スロットから前記プラズマヘッドの放出端までの距離 $n \cdot \lambda_g/2$ を有する、ここで、 λ_g ：マイクロ波の管内波長、n：整数、均一化線路を配置したことを特徴とするマイクロ波プラズマ処理方法。

【請求項2】

マイクロ波を用いて線状プラズマを形成し、被処理物表面を前記線状プラズマに水平に保ちつつ被処理物の移動中に大気圧下またはその近傍の圧力下で処理を被処理物に施すマイクロ波プラズマ処理方法において、

プラズマヘッドにE面スロットアンテナを備え、該スロットアンテナのスロットを λ_g のピッチで導波管の中心線上に形成し、かつ、前記スロットから前記プラズマヘッドの放出端までの距離 $n \cdot \lambda_g/2$ を有する、ここで、 λ_g ：マイクロ波の管内波長、n：整数、均一化線路を配置したことを特徴とするマイクロ波プラズマ処理方法。

【請求項3】

マイクロ波を用いて線状プラズマを形成し、被処理物表面を前記線状プラズマに水平に保ちつつ被処理物の移動中に大気圧下またはその近傍の圧力下で処理を被処理物に施すマイクロ波プラズマ処理方法において、

プラズマヘッドに均一化線路を備え、該均一化線路を高誘電率の材料で構成して、前記プラズマヘッドでの定在波の低減をしたマイクロ波プラズマ処理方法。

【請求項4】

マイクロ波を用いて線状プラズマを形成し、被処理物表面を前記線状プラズマに水平に保ちつつ被処理物の移動中に大気圧下またはその近傍の圧力下で処理を被処理物に施すマイクロ波プラズマ処理方法において、

プラズマヘッドに均一化線路を備え、該均一化線路を石英で構成し、その端部を $1/\lambda$ 延長して、

ここで、 λ ：石英内の自由空間波長、

前記プラズマヘッドでの定在波の低減をしたマイクロ波プラズマ処理方法。

【請求項5】

マイクロ波を用いて線状プラズマを形成し、被処理物表面を前記線状プラズマに水平に保ちつつ被処理物の移動中に大気圧下またはその近傍の圧力下で処理を被処理物に施すマイクロ波プラズマ処理方法において、

プラズマヘッドに均一化線路を備え、該均一化線路の端部に誘電損失の大なる電磁波吸収材を装着して、前記プラズマヘッドでの定在波の低減をしたマイクロ波プラズマ処理方法。

【請求項6】

マイクロ波を用いて線状プラズマを形成し、被処理物表面を前記線状プラズマに水平に保ちつつ被処理物の移動中に大気圧下またはその近傍の圧力下で処理を被処理物に施すマイクロ波プラズマ処理方法において、

プラズマヘッド内に設けた成膜ガス供給ノズルを成膜ガスがダウンフローするように構成したことを特徴とするマイクロ波プラズマ処理方法。

【請求項7】

マイクロ波を用いて線状プラズマを形成し、被処理物表面を前記線状プラズマに水平に保ちつつ被処理物の移動中に大気圧下またはその近傍の圧力下で処理を被処理物に施すマイクロ波プラズマ処理方法において、

プラズマヘッド内に設けた成膜ガス供給ノズルを成膜ガスがサイドフローするように構成したことを特徴とするマイクロ波プラズマ処理方法。

【請求項8】

マイクロ波を用いて線状プラズマを形成し、被処理物表面を前記線状プラズマに水平に保ちつつ被処理物の移動中に大気圧下またはその近傍の圧力下で処理を被処理物に施すマイクロ波プラズマ処理方法において、

プラズマヘッド内にシールドガスを供給するシールドガス供給管を接続し、該シールドガス供給管の下流側のプラズマ処理室内にシールドガスの均一供給を行う抵抗板を設けるとともに、排気側に均一排気を行う抵抗板を設けたことを特徴とするマイクロ波プラズマ処理方法。

【請求項9】

前記プラズマ処理室内の圧力 P_1 を前記プラズマヘッドの最外周部の圧力 P_3 より小とし、かつ圧力 P_3 を均一排気を行なう抵抗板近傍の圧力 P_2 より小としてガスシールドを形成して前記プラズマヘッドからのガスの漏洩を防止した請求項8に記載のマイクロ波プラズマ処理方法。

【請求項10】

前記マイクロ波プラズマ処理方法が、マイクロ波プラズマCVD処理方法であることを特徴とする請求項1から9のいずれか1項に記載のマイクロ波プラズマ処理方法。

【請求項11】

マイクロ波を用いて線状プラズマを形成し、被処理物表面を前記線状プラズマに水平に保ちつつ被処理物の移動中に大気圧下またはその近傍の圧力下で処理を被処理物に施すマイクロ波プラズマ処理装置において、

プラズマヘッドにH面スロットアンテナを備え、該スロットアンテナのスロットを $\lambda_g/2$ のピッチで導波管の中心線を挟んで交互に形成し、かつ、前記スロットから前記プラズマヘッドの放出端までの距離 $n \cdot \lambda_g/2$ を有する、ここで、 λ_g ：マイクロ波の管内波長、n：整数、均一化線路を配置したことを特徴とするマイクロ波プラズマ処理装置。

【請求項12】

マイクロ波を用いて線状プラズマを形成し、被処理物表面を前記線状プラズマに水平に保ちつつ被処理物の移動中に大気圧下またはその近傍の圧力下で処理を被処理物に施すマイクロ波プラズマ処理装置において、

プラズマヘッドにE面スロットアンテナを備え、該スロットアンテナのスロットを λ_g のピッチで導波管の中心線上に形成し、かつ、前記スロットから前記プラズマヘッドの放出端までの距離 $n \cdot \lambda_g/2$ を有する、ここで、 λ_g ：マイクロ波の管内波長、n：整数、均一化線路を配置したことを特徴とするマイクロ波プラズマ処理装置。

【請求項13】

マイクロ波を用いて線状プラズマを形成し、被処理物表面を前記線状プラズマに水平に保ちつつ被処理物の移動中に大気圧下またはその近傍の圧力下で処理を被処理物に施すマイクロ波プラズマ処理装置において、

プラズマヘッドに均一化線路を備え、該均一化線路を高誘電率の材料で構成して、前記プラズマヘッドでの定在波の低減をしたマイクロ波プラズマ処理装置。

【請求項14】

マイクロ波を用いて線状プラズマを形成し、被処理物表面を前記線状プラズマに水平に保ちつつ被処理物の移動中に大気圧下またはその近傍の圧力下で処理を被処理物に施すマイクロ波プラズマ処理装置において、

プラズマヘッドに均一化線路を備え、該均一化線路を石英で構成し、その端部を $1/\lambda$ 延長して、

ここで、 λ ：石英内の自由空間波長、

前記プラズマヘッドでの定在波の低減をしたマイクロ波プラズマ処理装置。

【請求項15】

マイクロ波を用いて線状プラズマを形成し、被処理物表面を前記線状プラズマに水平に保ちつつ被処理物の移動中に大気圧下またはその近傍の圧力下で処理を被処理物に施すマイクロ波プラズマ処理装置において、

プラズマヘッドに均一化線路を備え、該均一化線路の端部に誘電損失の大な電磁波吸収材を装着して、前記プラズマヘッドでの定在波の低減をしたマイクロ波プラズマ処理装置。

【請求項16】

マイクロ波を用いて線状プラズマを形成し、被処理物表面を前記線状プラズマに水平に保ちつつ被処理物の移動中に大気圧下またはその近傍の圧力下で処理を被処理物に施すマイクロ波プラズマ処理装置において、

プラズマヘッド内に設けた成膜ガス供給ノズルを成膜ガスがダウンフローするように構成したことを特徴とするマイクロ波プラズマ処理装置。

【請求項17】

マイクロ波を用いて線状プラズマを形成し、被処理物表面を前記線状プラズマに水平に保ちつつ被処理物の移動中に大気圧下またはその近傍の圧力下で処理を被処理物に施すマイクロ波プラズマ処理装置において、

プラズマヘッド内に設けた成膜ガス供給ノズルを成膜ガスがサイドフローするように構成したことを特徴とするマイクロ波プラズマ処理装置。

【請求項18】

マイクロ波を用いて線状プラズマを形成し、被処理物表面を前記線状プラズマに水平に保ちつつ被処理物の移動中に大気圧下またはその近傍の圧力下で処理を被処理物に施すマイクロ波プラズマ処理装置において、

プラズマヘッド内にシールドガスを供給するシールドガス供給管を接続し、該シールドガス供給管の下流側のプラズマ処理室内にシールドガスの均一供給を行う抵抗板を設けるとともに、排気側に均一排気を行う抵抗板を設けたことを特徴とするマイクロ波プラズマ処理装置。

【請求項19】

前記プラズマ処理室の圧力 P_1 を前記プラズマヘッドの最外周部の圧力 P_3 より小とし、かつ圧力 P_3 を均一排気を行なう抵抗板近傍の圧力 P_2 より小としてガスシールドを形成して前記プラズマヘッドからのガスの漏洩を防止した請求項18に記載のマイクロ波プラズマ処理装置。

【請求項20】

前記マイクロ波プラズマ処理装置が、マイクロ波プラズマCVD装置であることを特徴とする請求項11から19のいずれか1項に記載のマイクロ波プラズマ処理装置。

【請求項21】

マイクロ波を用いて線状プラズマを形成し、被処理物表面を前記線状プラズマに水平に保ちつつ被処理物の移動中に大気圧下またはその近傍の圧力下で処理を被処理物に施すマイクロ波プラズマ処理装置において、

プラズマヘッドにH面スロットアンテナを備え、該スロットアンテナのスロットを $\lambda_g/2$ のピッチで導波管の中心線を挟んで交互に形成し、かつ、前記スロットから前記プラズマヘッドの放出端までの距離 $n \cdot \lambda_g/2$ を有する、ここで、 λ_g ：マイクロ波の管内波長、n：整数、均一化線路を配置したことを特徴とするマイクロ波プラズマ処理装置のプラズマヘッド。

【請求項22】

マイクロ波を用いて線状プラズマを形成し、被処理物表面を前記線状プラズマに水平に保ちつつ被処理物の移動中に大気圧下またはその近傍の圧力下で処理を被処理物に施すマイクロ波プラズマ処理装置において、

プラズマヘッドにE面スロットアンテナを備え、該スロットアンテナのスロットを λ_g のピッチで導波管の中心線上に形成し、かつ、前記スロットから前記プラズマヘッドの放出端までの距離 $n \cdot \lambda_g/2$ を有する、ここで、 λ_g ：マイクロ波の管内波長、n：整数、均一化線路を配置したことを特徴とするマイクロ波プラズマ処理装置のプラズマヘッド。

【請求項23】

マイクロ波を用いて線状プラズマを形成し、被処理物表面を前記線状プラズマに水平に保ちつつ被処理物の移動中に大気圧下またはその近傍の圧力下で処理を被処理物に施すマイクロ波プラズマ処理装置において、

プラズマヘッドに均一化線路を備え、該均一化線路を高誘電率の材料で構成して、前記プラズマヘッドでの定在波の低減をしたマイクロ波プラズマ処理装置のプラズマヘッド。

【請求項24】

マイクロ波を用いて線状プラズマを形成し、被処理物表面を前記線状プラズマに水平に保ちつつ被処理物の移動中に大気圧下またはその近傍の圧力下で処理を被処理物に施すマイクロ波プラズマ処理装置において、

プラズマヘッドに均一化線路を備え、該均一化線路を石英で構成し、その端部を $1/\lambda$ 延長して、

ここで、 λ ：石英内での自由空間波長、

前記プラズマヘッドでの定在波の低減をしたマイクロ波プラズマ処理装置のプラズマヘッド。

【請求項25】

マイクロ波を用いて線状プラズマを形成し、被処理物表面を前記線状プラズマに水平に保ちつつ被処理物の移動中に大気圧下またはその近傍の圧力下で処理を被処理物に施すマイクロ波プラズマ処理装置において、

プラズマヘッドに均一化線路を備え、該均一化線路の端部に誘電損失の大なる電磁波吸収材を装着して、前記プラズマヘッドでの定在波の低減をしたマイクロ波プラズマ処理装置のプラズマヘッド。

【請求項26】

マイクロ波を用いて線状プラズマを形成し、被処理物表面を前記線状プラズマに水平に保ちつつ被処理物の移動中に大気圧下またはその近傍の圧力下で処理を被処理物に施すマイクロ波プラズマ処理装置において、

プラズマヘッド内に設けた成膜ガス供給ノズルを成膜ガスがダウンフローするように構成したことを特徴とするマイクロ波プラズマ処理装置のプラズマヘッド。

【請求項27】

マイクロ波を用いて線状プラズマを形成し、被処理物表面を前記線状プラズマに水平に保ちつつ被処理物の移動中に大気圧下またはその近傍の圧力下で処理を被処理物に施すマイクロ波プラズマ処理装置において、

プラズマヘッド内に設けた成膜ガス供給ノズルを成膜ガスがサイドフローするように構成したことを特徴とするマイクロ波プラズマ処理装置のプラズマヘッド。

【請求項28】

マイクロ波を用いて線状プラズマを形成し、被処理物表面を前記線状プラズマに水平に保ちつつ被処理物の移動中に大気圧下またはその近傍の圧力下で処理を被処理物に施すマイクロ波プラズマ処理装置において、

プラズマヘッド内にシールドガスを供給するシールドガス供給管を接続し、該シールドガス供給管の下流側のプラズマ処理室内にシールドガスの均一供給を行う抵抗板を設けるとともに、排気側に均一排気を行う抵抗板を設けたことを特徴とするマイクロ波プラズマ処理装置のプラズマヘッド。

【請求項29】

前記プラズマ処理室内の圧力 P_1 を前記プラズマヘッドの最外周部の圧力 P_3 より小とし、かつ圧力 P_3 を均一排気を行なう抵抗板近傍の圧力 P_2 より小としてガスシールドを形成して前記プラズマヘッドからのガスの漏洩を防止した請求項28に記載のマイクロ波プラズマ処理装置のプラズマヘッド。

【請求項30】

前記マイクロ波プラズマ処理装置が、マイクロ波プラズマCVD処理装置であることを特徴とする請求項20から29のいずれか1項に記載のプラズマヘッド。

【請求項31】

請求項1の方法を用いて成膜することを特徴とするF P Dまたは半導体デバイスの製造方法。

【書類名】明細書

【発明の名称】マイクロ波プラズマ処理方法、マイクロ波プラズマ処理装置及びそのプラズマヘッド

【技術分野】

【0001】

本発明は、F P D (フラットパネル・ディスプレイ)用大型ガラス基板、ウエハ等の基板のマイクロ波プラズマ処理に用いるマイクロ波プラズマ処理方法、マイクロ波処理装置及びそのプラズマヘッドに関する。

【背景技術】

【0002】

従来、例えば、F P D用大型ガラス基板、ウエハ等の基板のマイクロ波プラズマC V D処理装置では、真空状態に保たれたロードロック室を経て、同じく所定の真空状態に維持された処理室内にプラズマC V D処理を施す基板を搬入・搬出して枚葉式で所定のバッチ処理を行っていた。そのため、基板の処理室への搬入・搬出毎に処理室の真空引き及び大気開放を行わなければならず、とくに複数の異った処理を基板に施す場合には、それぞれの処理は、隔離された複数の空間(処理室)を移動しながら、バッチ式で行わざるをえなかった。それ故、基板のC V D処理が連続的に行えず、また、高価な真空処理手段を必要としていた。

【0003】

そこで、このような真空処理手段を不要とし、かつ、インライン方式で連続的に大気圧(常圧)下でプラズマC V D処理を行う技術が出現した。この常圧プラズマC V D技術では、真空を使わず大気圧のままで動作するプラズマ技術を用いウエハ等の被処理基板を連続的にC V D、エッチング、あるいはアッシング処理する(非特許文献1)。さらに、この常圧プラズマC V D技術では、ベルトコンベアのような循環式のウエハ搬送装置上にウエハを載置し、複数の常圧プラズマ装置により異った処理を流れ生産方式で行うようにしている(非特許文献2)。

【0004】

また、さらに、電磁波を用いて線状のプラズマを形成し、被処理体表面を線状プラズマに対して水平に保ちつつ、被処理物(例えば、ウエハ)とプラズマの相対位置を移動しつつ被処理物の表面処理を行なうプラズマ処理装置(例えば、C V D装置)が提案されている(特許文献1)。

【非特許文献1】湯浅基和、真空を使わないプラズマC V D技術、NIKKEI MICRODEVICES 2001年1月号 3頁

【非特許文献2】湯浅基和、真空を使わないプラズマ技術、NIKKEI MICRODEVICES 2001年4月号 139~146頁

【特許文献1】特開2001-93871号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

しかしながら、このような従来のマイクロ波プラズマC V D処理方法及び処理装置では、インライン方式で連続して異った処理を行うことができるが、プラズマヘッドのマイクロ波供給部でのマイクロ波の不均一性、処理ガスのフローとガスシールド不完全性、定在波によるプラズマ密度の不均一化及びプラズマヘッドのスロット部における異常放電の防止、等において問題点があった。

【0006】

そこで、本発明は、このような従来のマイクロ波プラズマC V D処理方法及び処理装置のもつ問題点に鑑みてなされたもので、これらの問題点を除去することにより、高密度マイクロ波源を利用して線状、かつ高密度プラズマを発生させ、連続して異種の成膜処理を可能にしたマイクロ波プラズマ処理方法、マイクロ波プラズマ処理装置及びそのプラズマヘッドを提供することを目的としている。

【課題を解決するための手段】

【0007】

本発明のマイクロ波プラズマ処理方法、マイクロ波プラズマ処理装置及びそのプラズマヘッドは、マイクロ波を用いて線状プラズマを形成し、被処理物表面を前記線状プラズマに水平に保ちつつ被処理物の移動中に大気圧下またはその近傍の圧力下で処理を被処理物に施す際、プラズマヘッドにH面スロットアンテナを備え、該スロットアンテナのスロットを $\lambda_g/2$ のピッチで導波管の中心線を挟んで交互に形成し、かつ、前記スロットから前記プラズマヘッドの放出端までの距離n· $\lambda_g/2$ を有する、ここで、 λ_g ：マイクロ波の管内波長、均一化線路を配置したことを特徴とする。

【0008】

また、本発明のマイクロ波プラズマ処理方法、マイクロ波プラズマ処理装置及びそのプラズマヘッドは、同様の処理条件下において、プラズマヘッドにE面スロットアンテナを備え、該スロットアンテナのスロットを λ_g のピッチで導波管の中心線上に形成し、かつ、前記スロットから前記プラズマヘッドの放出端までの距離をn· $\lambda_g/2$ を有する、ここで、 λ_g ：マイクロ波の管内波長、均一化線路を配置したことを特徴とする。

【0009】

さらに、本発明のマイクロ波プラズマ処理方法、マイクロ波プラズマ処理装置及びそのプラズマヘッドは、同様の処理条件下において、プラズマヘッドに均一化線路を備え、該均一化線路を高誘電率の材料で構成して、また、該均一化線路を石英で構成し、その端部を $1/4\lambda$ 延長して、ここで、 λ ：石英の自由空間波長、さらに、該均一化線路の端部に誘電損失の大なる電磁波吸収材を装着して、前記プラズマヘッドでの定在波の低減をしたことを特徴とする。

【0010】

またさらに、本発明のマイクロ波プラズマ処理方法、マイクロ波プラズマ処理装置及びそのプラズマヘッドは、同様の処理条件下において、プラズマヘッド内に設けた成膜ガス供給ノズルを成膜ガスがダウントフローするように、また、成膜ガス供給ノズルを成膜ガスがサイドフローするように構成したことを特徴とする。

【0011】

さらに、本発明のマイクロ波プラズマ処理方法、マイクロ波プラズマ処理装置及びそのプラズマヘッドは、同様の処理条件下において、プラズマヘッド内にシールドガスを供給する供給管を接続し、該シールドガス供給管の下流側のプラズマ処理室内にシールドガスの均一供給を行う抵抗板を設けるとともに、排気側に均一排気を行う抵抗板を設け、また、前記プラズマ処理室の圧力P₁を前記プラズマヘッドの最外周部の圧力P₃より小とし、かつ圧力P₃を均一排気を行なう抵抗板近傍の圧力P₂より小として前記プラズマヘッドからのガスの漏洩を防止することを特徴とする。

【発明の効果】

【0012】

本発明のマイクロ波プラズマ処理方法、マイクロ波プラズマ処理装置及びそのプラズマヘッドによれば、高密度マイクロ波源を利用して、プラズマヘッドから線状に高密度プラズマを発生させたので、連続した高精度のCVD処理が可能となるとともに、異なるプラズマ源を成膜処理する基板の搬送方向に並べて配置したので、連続した異種成膜が可能となる。

【0013】

さらに、本発明のマイクロ波プラズマ処理方法、マイクロ波プラズマ処理装置及びそのプラズマヘッドの均一化線路によれば、その基本寸法の最適条件の設定、定在波の除去により、より均一なマイクロ波をプラズマヘッドのスリットから放出でき、かつ、ガスダウントフローとガスサイドフローのガスの流し方とにより、成膜ガスの均一性が保たれるとともに、成膜レートの向上を図ることができる。

【0014】

また、極めて精度の高い成膜ガスのガスシールドが得られる等の、格別な効果を奏する

ようになる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0015】

以下、添付図面に基づいて本発明のマイクロ波プラズマ処理方法、マイクロ波プラズマ処理装置及びそのプラズマヘッドの実施の形態を詳細に説明する。

【0016】

マイクロ波プラズマCVD装置

まず、添付した図1と図2に示すように、本発明の一実施形態であるマイクロ波プラズマCVD装置（以下、「本発明のCVD装置」という）1は、基板G（例えば、ガラス基板）をプラットホーム6aあるいは6bからロードロックモジュール2に搬入して、搬送アーム2aによりトランスファモジュール3を経て、そのロボットアーム3aによりプロセスマジュール4に搬入して、プラズマヘッド5により高密度の線状プラズマを発生させ、その存在下で、基板（被処理物）Gの処理面を線状プラズマに水平に保ちつつ、基板GにプラズマCVD処理をインライン方式で連続して行うようになっている。とくに、プラズマヘッド5は、後述するように（図3参照）、複数の異った複数の成膜プロセスが実施できるように、異った成膜ガスを適用できる1基あるいは数基の同種のプラズマヘッドを並列・クラスタリングして構成されている。

【0017】

ここで、トランスファモジュール3から基板Gは、ロボットアーム3aにより搬出され、プロセスマジュール4内をガイドロール9bにより案内されて循環する無端式基板搬送機構9に配設された基板ステージ9a上に載置され静電チャック（図示せず）等により固定されてプロセスマジュール4内を移動しつつ、プラズマヘッド5によりCVD処理される。プラズマCVD処理後の基板Gは、基板ステージ9aから離脱されてプロセスマジュール4の終端から次の処理工程へ搬出され、空となった基板ステージ9aは、無端式基板搬送機構9によりプロセスマジュール4の始端に戻るようになっている。また、無端式基板搬送機構9の下部には、ガスユニット7と冷却水ユニット8が配設してある。

【0018】

プラズマヘッド

本発明の一実施形態であるマイクロ波プラズマCVD装置に用いるプラズマヘッド5は、図3に示すように、複数基、例えば3基5a, 5b, 5c、隔壁（図示なし）を介して並置され、異った成膜ガスにより異った成膜処理を基板ステージ9aに載置された基板Gに大気圧（常圧）下あるいはその近傍の圧力下で施すように構成する。例えば、表1に示すように、プラズマヘッド5aでは、Si₃N₄膜用ガスによる成膜プロセスを、プラズマヘッド5bでは、a-Si膜用ガスによる成膜プロセスを、また、プラズマヘッド5cでは、n+Si膜用ガスによる成膜プロセスをそれぞれ施し、基板Gの表面に異った成膜層3層を形成するようになっている。

【0019】

このプラズマヘッド5には、図4に示すようなマイクロ波供給部50を適用する。

【0020】

【表1】

成膜ガス	プロセスガス	クリーニングガス	キャリアガス
N+Siプロセス	SiH ₄ PH ₃	NF ₃	ArあるいはHe
a-Siプロセス Si ₃ N ₄ プロセス	SiH ₄ NH ₂ H ₂	NF ₃	ArあるいはHe
パンク材撥水処理 直接強化	F ₂ , O ₂	NF ₃	Ar
ステージクリーニング	-	NF ₃	Ar

図4に示すマイクロ波供給部50は、プラズマヘッド5に内蔵され、マイクロ波励起大気圧線（ライン）状プラズマ発生部として機能する（図4では、その構成を明確に示すために天地を逆にして図示してある。）。

【0021】

このマイクロ波供給部50は、図5に示すように、マイクロ波を用いて線（ライン）状のプラズマを形成するのに用いられ、H面あるいはE面スロットアンテナとしての導波管51と均一化線路52とから構成されている。導波管51には、均一化線路52との間に複数のスロット53からなるスロットアレイ（スロット板）51cが形成され、このスロット板51cは、例えば図6に示すように、H面アンテナでは、管内波長λgの1/2のピッチで導波管51の中心線より左右に交互（千鳥状）に配置された複数のスロット53により構成されている。そして、均一化線路52の終端であるマイクロ波放出端54には、スリット55が形成され、このスリット55から均一化したマイクロ波が放出される。

【0022】

均一化線路52では、スロット板51cから放出された位相の揃ったマイクロ波を利用して、空間的により均一化したマイクロ波の波面を形成する。この均一化線路52は、平行平板線路であって、具体的には、その中心線を長軸とする扁平矩形導波管として構成されている。この均一化線路52により、各スロット53から離散的に放出されたマイクロ波が均一化され、その中心線方向により均一な強度をもつ波面が形成され、この均一化されたマイクロ波はスリット55からプラズマ中に放出される。

【0023】

とくに、本発明のCVD装置に用いるマイクロ波供給部50のH面あるいはE面アンテナからなる均一化線路は、図5（a），（b）に示すように、その均一化線路52のスロット板51cからマイクロ波の放出端54までの寸法をn・λg/2（ここで、λg：管内波長、n：整数）、また、その巾はλg/2として計算して設計する。そして、均一化線路52は、Al₂O₃あるいはAlNあるいは石英のような誘電体もしくは気体（気体空間を形成する）で形成し、また、マイクロ波の放出端54には、フッ化保護膜54aをコーティングする。なお、導波管51は、Al₂O₃あるいはAlNあるいは石英のような誘電体もしくは気体（気体空間）で形成する。

【0024】

また、図6（b）に示すように、同位相放出型H面アンテナでは、図示のように、λg/2ピッチでその中心線から同位相の電流が流れ、中心線では、電界がほぼ零となるので、比較的電界の高い個所（中心線から距離dだけオフセットした個所）にスロット53aを、図6（a）に示すように、導波管51aに中心線を挟んで交互（千鳥状）に形成する。なお、ここで、導波管51aの終端から末端に形成されたスロット53aの中点まではλg/2とする。

【0025】

E面アンテナでは、図7（a），（b）に示すように、中心線上にλg間隔で導波管共振器51bにスロット53bを形成する。

【0026】

図8は、このようにして構成されたH面アンテナのスロット板51cの平面図を示す。

【0027】

また、ここで、均一化線路52の基本寸法の計算方法の別の計算例を示すと、図9に示すように、

ここで、

【0028】

【数1】

$$\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_c}\right)^2}}$$

λ ：自由空間波長

λ_c ：遮断波長

λ_g ：管内波長

$\lambda_c = 2a$

a：導波管の巾

b：導波管の高さ

均一化線路52の長さlは、基本は $\lambda/4 \sim 3/4\lambda$ とし、その値はシミュレーションで求める。この計算方法では、管内波長 λ_g ではなく、自由空間波長 λ を用いて計算する。同様に均一化線路52の巾も $\lambda/2$ として計算する。

【0029】

さらにまた、図10に示すように、均一化線路52をスリット55側を石英Cで、また、スロット53と石英Cとの間に大気Aを介在させて構成した実施例では、

大気中の石英の自由空間波長 λ （石英）は、

λ （大気）、 ϵ ：誘電率とすると、

【0030】

【数2】

$$\lambda(\text{石英}) = \frac{\lambda(\text{大気})}{\sqrt{\epsilon}}$$

λ ：自由空間波長

ϵ ：誘電率

図10に示した各部の計算比を適用して【数2】にしたがって石英（ $\epsilon = 3.58$ ）の場合の波長短縮後の波長を計算すると、表2に示すようになる。

【0031】

【表2】

	誘電率 ϵ	波長 λ	0.75 λ	0.13 λ	0.62 λ
大気	1	122.4mm	91.8mm	16mm	-
石英	3.58	64.7mm	48.5mm	-	40mm

さらに、定在波によるプラズマヘッドでのマイクロ波の強度分布の濃淡をなくすために、定在波の低減手段を均一化線路52に施す。

【0032】

この定在波低減方法では、図11(a)に示すように、均一化線路52の空間を誘電率の高いアルミナ(Al_2O_3)等で埋め波長を短縮する。この場合、均一化線路52の長さ1は、 λ (自由空間波長)の整数倍 $1 = n \cdot \lambda$ となる。

【0033】

また、図11(b)に示すように、均一化線路52の端部を $1/4\lambda$ 延長する。

【0034】

さらにまた、図11(c)に示すように、均一化線路52の端部に誘電損失の大きな電磁波吸収材(例えばダミーロードや水)を装着して電磁波を吸収する。

【0035】

また、スロット部におけるマイクロ波出力の上昇に伴う異常放電(スパーク)を防止し、局所的な温度上昇により均一化線路52を構成する誘電体が割れるのを回避するために、図10に示すように、スロット板51cを3~5mm程度の厚みをもつ剛性のある金属板から構成し、石英、アルミナ等からなる誘電体Cからスロット板51cを大気空間Aを介して隔離するようにする。

【0036】

CVDガスの流し方

本発明のマイクロ波プラズマCVD装置における成膜用CVDガスの流し方については、1) ガスダウンフロー、2) ガスサイドフロー、の2方法が用いられる。

【ガスダウンフロー】

ガスダウンフロー方式は、図12に示すように、プラズマヘッド60aを導波管61a、スペーサー64a、ベースフランジ71a、ベースフランジ71aに接続した一対の排気ポート73a、基板6の上に配設された電極69aで構成し、スペーサー64aと導波管61aの下端面との間にスリット板62aを、また、スペーサー64aとベースフランジ71aの上端面との間に一対のOーリング65aを介してウインドウ63aを配設し、さらにウインドウ63aの下部にスペーサー67aを配設して、スペーサー67a(均一化線路：)に希釈ガス噴出口aと原料ガス噴出口bをもつガス供給ノズル66aと、そして、プラズマヘッド60a内に搬入された電極69aにより生起されたプラズマ雰囲気下にある基板Gの成膜面に向って希釈ガス(例えば、Ar, He)と原料ガス(例えば、SiH₄)との成膜ガスを矢印で示すように、噴出口a, bから基板Gに向ってダウンフローさせる。

【0037】

このガスダウンフローにより、特にプラズマ密度の高い部分に成膜ガスが流れ、成膜レートが飛躍的に向上するほか、成膜ガスの均一性が保たれ、ガス供給ノズルへの残留物の付着が防止されることになる。

【ガスサイドフロー】

ガスサイドフロー方式は、図13に示すように、プラズマヘッド60bを導波管61b、スペーサー64b、ベースフランジ71b、変換フランジ72b、ベースフランジ71bに接続した一対のガス供給ポート75b、排気ポート73b、基板Gの上に配設された電極69bで構成し、スペーサー64bと導波管61bの下端面との間にスリット板62bを、またスペーサー64bとベースフランジ71bの上端面との間に一対のローリング65bを介してウインドウ63bを配設し、ウインドウ63bの下端にスペーサー67b(均一化線路)を配設する。さらに、スペーサー67bの下端面と基板Gの間に形成されたプラズマ室内に三角形状をしたヘッド76bを配設する。そして、このプラズマ室内にガス供給ポート75bの噴出口aから希釈ガス(例えば、Ar, He)を、また別の噴出口bから原料ガス(例えば、SiH₄)を供給する。両ガスが混合して形成された成膜ガスは、矢印に示すように、ヘッド76bの表面に添って基板Gに向って流れ(サイドフロー)成膜を行い、排気ポート73bから排気系へ排出される。この際、ヘッド76bの平

坦面77bの面積を変えることにより、成膜レート及び成膜状況を調整できる。

【0038】

このガスサイドフローにより、成膜ガスの均一性が良くなつて排気が促進されるとともに、成膜面の予測が可能になり、かつ、プラズマヘッドのクリーニングが容易になる。また、基板上の成膜巾をガス供給ポートのノズル先端形状で制御できるようになる。

【0039】

ガスシールド

本発明のマイクロ波プラズマCVD装置のプラズマヘッド60には、図14に示すような、ガスシールドを施す。

【0040】

すなわち、図14(a)に示すように、プラズマヘッド60の導波管61の下端に設けられたスペーサー64に真空排気管82を配設し、かつ、スペーサー64の下端に配設され、電極69が配置されたプラズマ処理室を形成する変換フランジ72にN₂、Arガス等のシールドガス供給管83、83で接続し、それらの下流側にシールドガス(N₂, Ar)の均一供給を行う抵抗板81, 81を配設する。さらに、プラズマ処理室内のガス供給ノズル66から供給された成膜ガスの均一排気を行うための抵抗板80, 80を成膜ガスの排気端に設ける。

【0041】

そして、図14(b)に示すように、それぞれの部位の圧力P₁(プラズマ処理室の圧力、例えば常圧～1Torr), P₂(抵抗板近傍の圧力), P₃(プラズマヘッド最外周部の圧力)をP₁<P₃<P₂になるように、構成すると、各部位間に圧力の壁(山の部分)が形成されて成膜処理室からのガスの漏洩が防止され、完全なガスシールドが構成されるようになる。

【図面の簡単な説明】

【0042】

【図1】本発明の一実施形態であるマイクロ波プラズマCVD装置の概念構成を示す正面図。

【図2】図1に示したマイクロ波プラズマCVD装置の平面図。

【図3】図1に示したマイクロ波プラズマCVD装置に用いるプラズマヘッドを3基並列してクラスタリングした装置の斜視図。

【図4】図3に示したプラズマヘッドのマイクロ波供給部の斜視図。

【図5】図4に示したマイクロ波供給部の概念図であつて、図4(a)は、その縦断面図、図4(b)は、その横断面図。

【図6】図4に示したマイクロ波供給部に用いるアンテナの斜視図とアンテナ内のマイクロ波の伝播を示す図であつて、図6(a)は、同位相放出型H面アンテナの斜視図、また図6(b)は、マイクロ波のH面アンテナ内での伝播を示す図。

【図7】図7(a)は、同位相放出型E面アンテナの斜視図、図7(b)は、マイクロ波のE面アンテナ内での伝播を示す図。

【図8】図6に示した同位相放出型H面アンテナのスロット板の諸元を示す平面図。

【図9】本発明の一実施形態であるマイクロ波プラズマCVD装置に用いるプラズマヘッドのマイクロ波供給部の基本寸法の計算方法を示す概念図。

【図10】本発明の一実施形態であるマイクロ波プラズマCVD装置に用いるプラズマヘッドのマイクロ波供給部の均一化線路の基本寸法の別の計算方法を示す概念図。

【図11】図1に示したマイクロ波プラズマCVD装置に用いるプラズマヘッドのマイクロ波供給部における定在波低減を図る手段を示すものであつて、図11(a)は、その均一化線路を誘電率の高い材料で埋めた実施例を、図11(b)は、均一化線路端を延長した実施例を、図11(c)は、均一化線路端に電磁波吸収材を取り付けた実施例を示す。

【図12】図1に示したマイクロ波プラズマCVD装置のプラズマヘッド(縦断面図)において、CVDガスの流し方を示すものであつて、CVDガスをプラズマ処理室

内でダウンフローした実施例を示す。

【図13】図1に示したマイクロ波プラズマCVD装置のプラズマヘッド（縦断面図）において、CVDガスをプラズマ処理室内でサイドフローした実施例を示す。

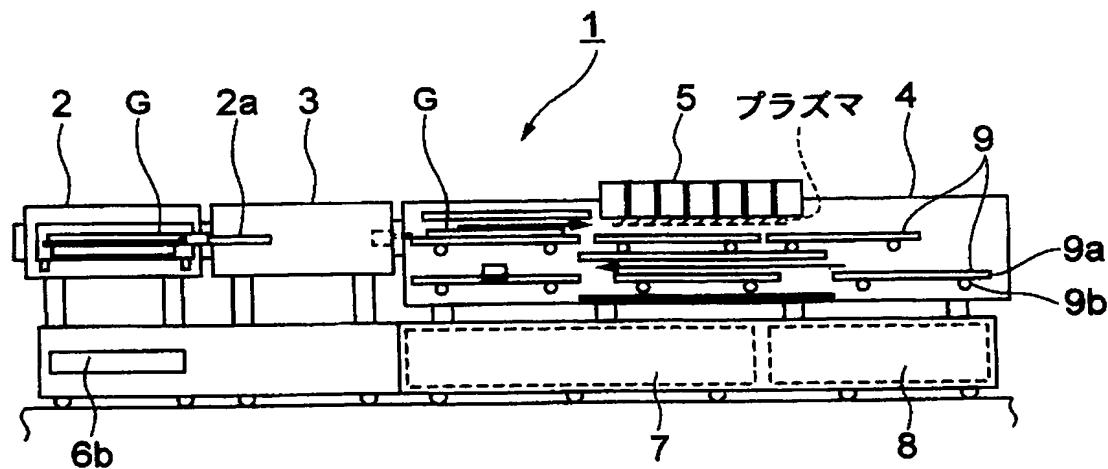
【図14】図1に示したマイクロ波プラズマCVD装置のプラズマヘッドにおいて、ガスシールドの施し方を示し、図14（a）は、プラズマヘッドの縦断面図、図14（b）は、プラズマヘッド内のガス圧の分布を示す。

【符号の説明】

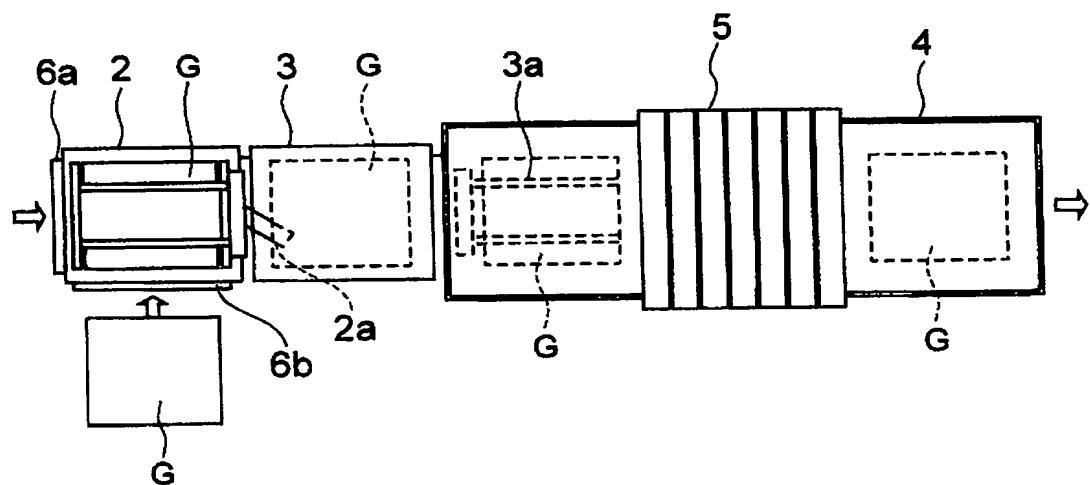
【0043】

- 1 マイクロ波プラズマCVD装置
- 2 ロードロックモジュール
- 3 トランスファモジュール
- 4 プロセスモジュール
- 5 プラズマヘッド
- 6 被処理基板搬入プラットホーム
- 7 ガスユニット
- 8 冷却水ユニット
- 9 無端式基板搬送機構
- 9 a 基板ステージ
- 5 0 マイクロ波供給部
- 5 1 導波管
- 5 1 c スロット板
- 5 2 均一化線路
- 5 3 スロット
- 5 4 放出端
- 5 5 スリット
- 6 0 プラズマヘッド
- 6 1 導波管
- 6 2 スリット板
- 6 3 ウィンドウ
- 6 4 スペーサー
- 6 6 ガス供給ノズル
- 6 7 スペーサー
- 6 9 電極
- 7 1 ベースフランジ
- 7 3 排気ポート
- 7 5 ガス供給ポート
- 8 0 均一排気用抵抗板
- 8 1 均一供給用抵抗板

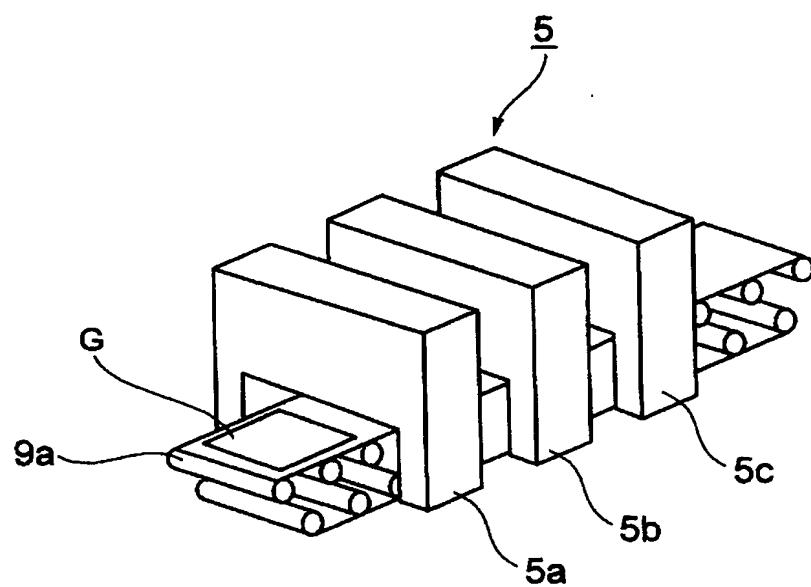
【書類名】 図面
【図 1】



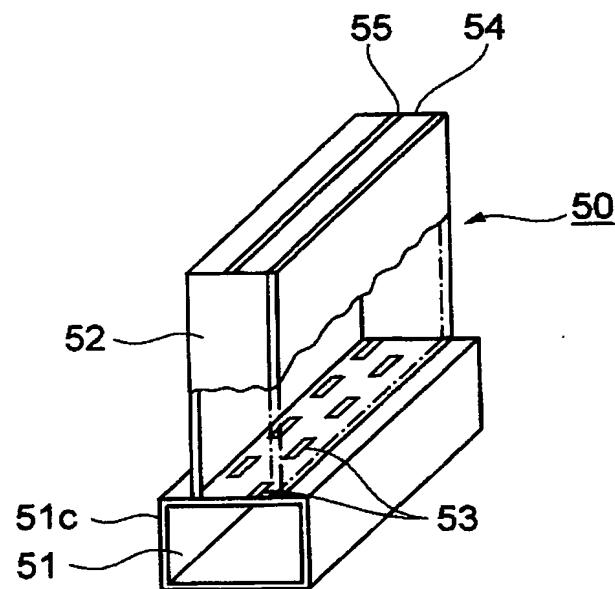
【図 2】



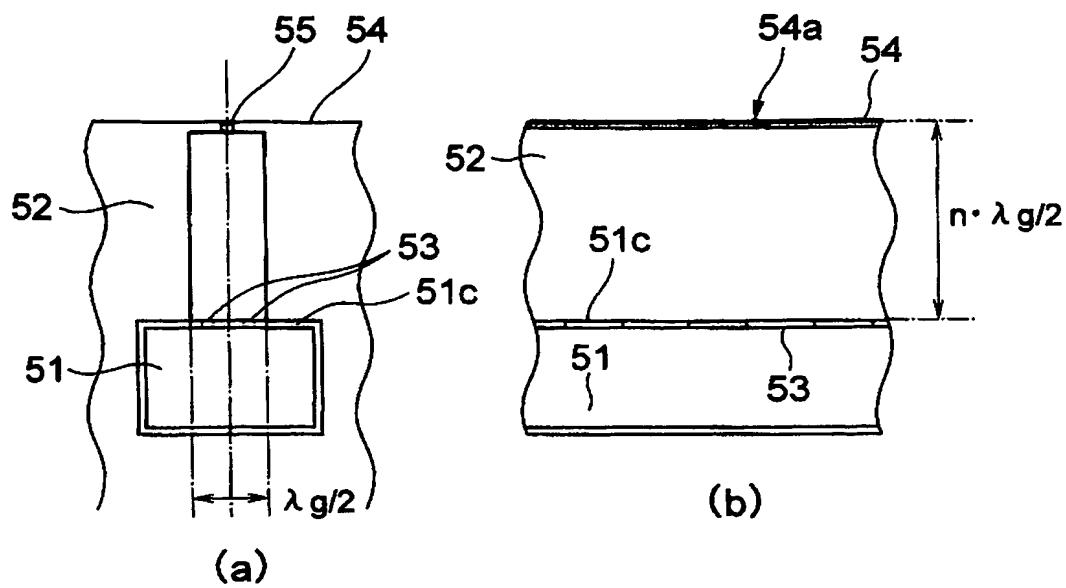
【図3】



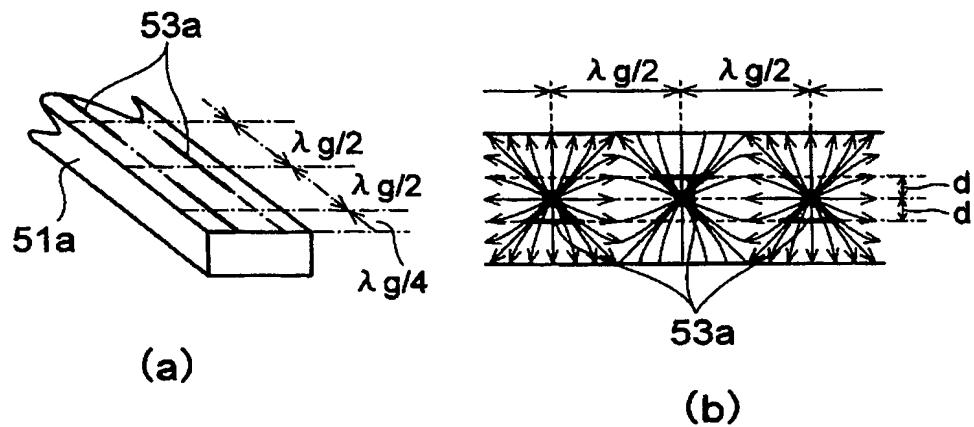
【図4】



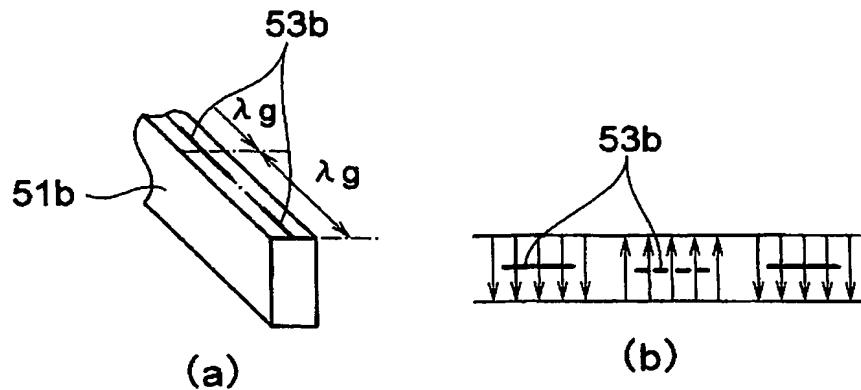
【図 5】



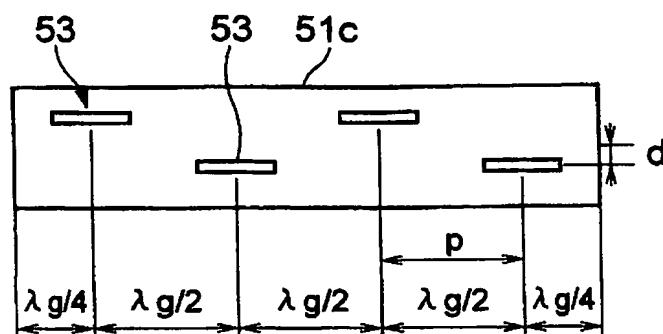
【図 6】



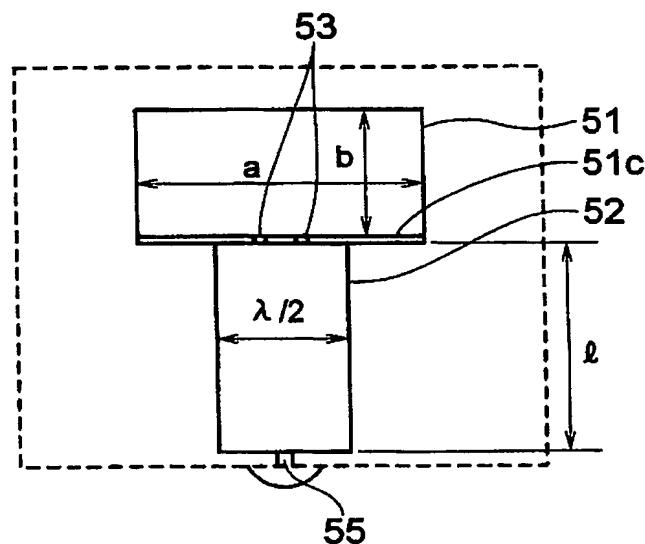
【図 7】



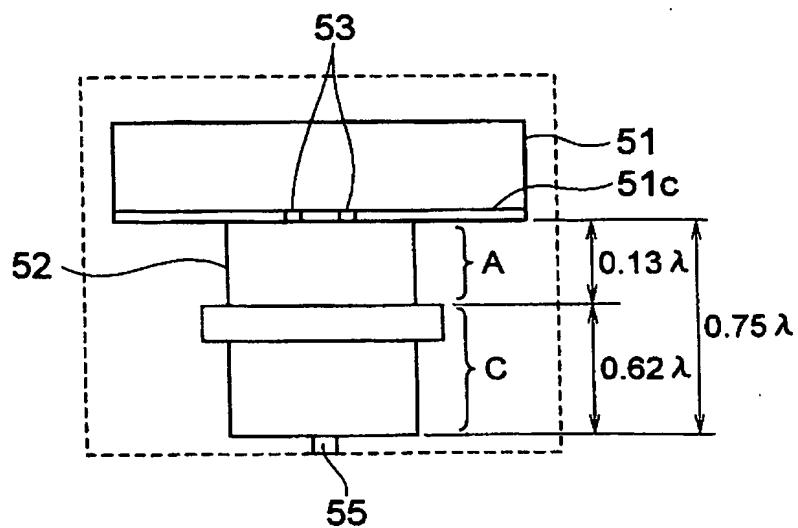
【図8】



【図9】

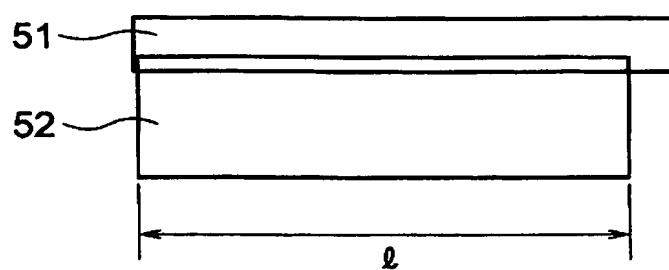


【図10】

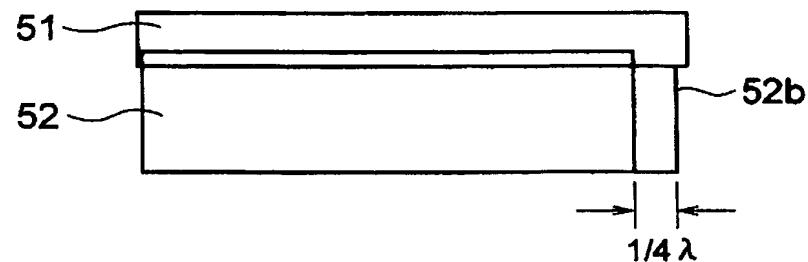


【図11】

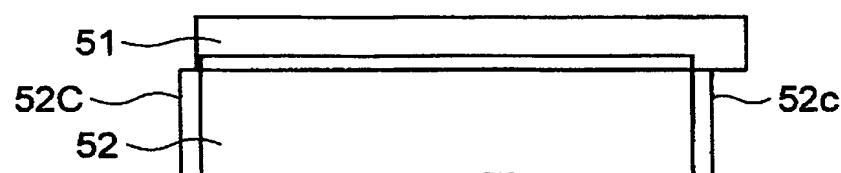
(a)



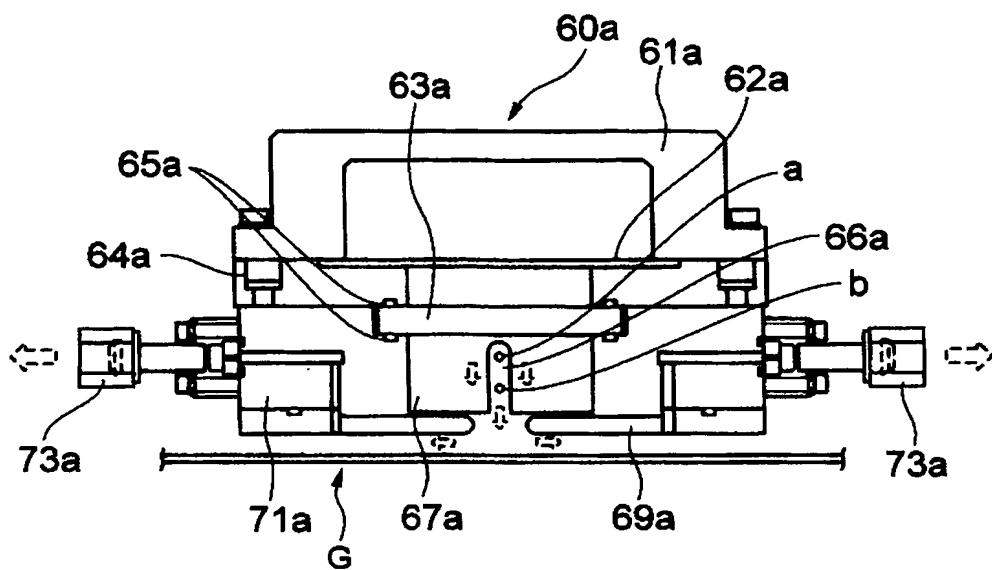
(b)



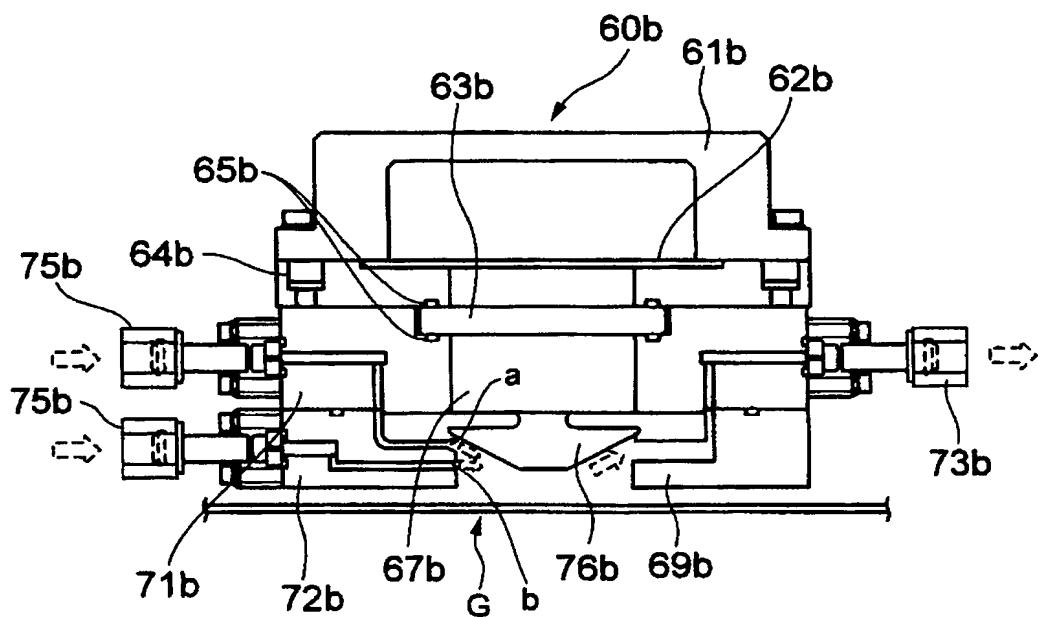
(c)



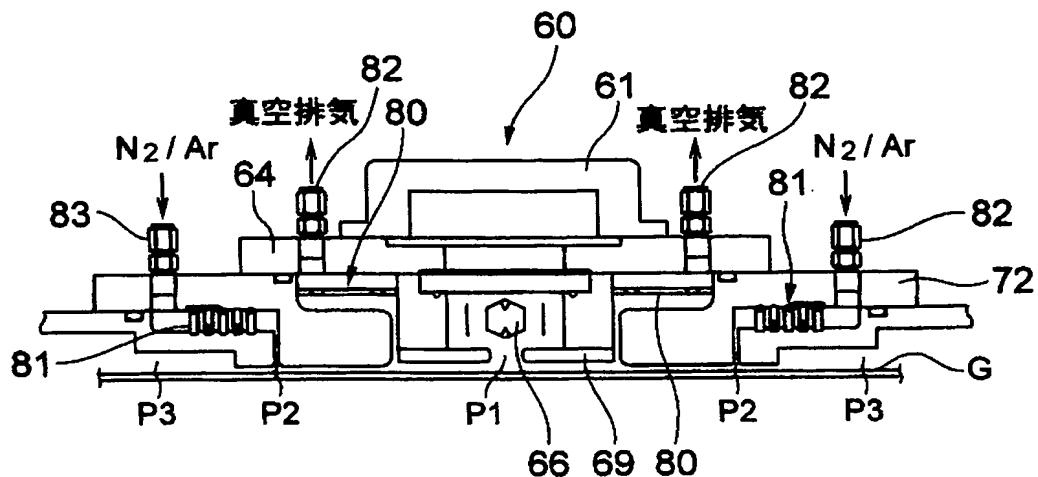
【図12】



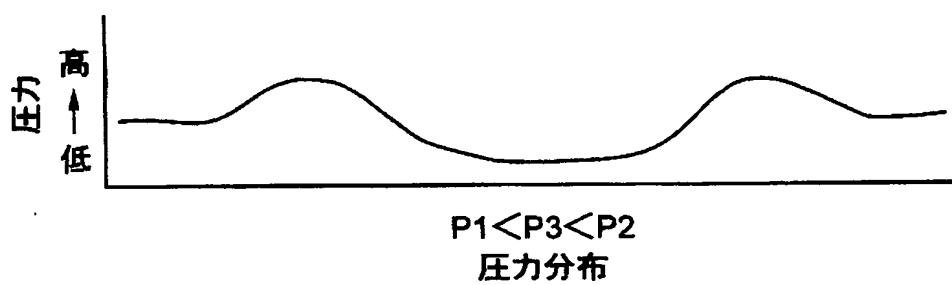
【図13】



【図14】



(a)



(b)

【書類名】要約書

【要約】

【課題】 プラズマヘッドに供給するマイクロ波の均一化、処理ガスのフローとガスシールドを完全化し、かつ定在波によるプラズマ密度の不均一化及びプラズマヘッドのスロット部における異常放電の防止することにより、高密度マイクロ波源を利用して線状、かつ高密度プラズマを発生させ、連続して異種の成膜処理を可能にしたマイクロ波プラズマ処理方法、マイクロ波プラズマ処理装置及びそのプラズマヘッドを提供することを目的としている。

【解決手段】 マイクロ波を用いて線状プラズマを形成し、被処理物表面を前記線状プラズマに水平に保ちつつ被処理物の移動中に大気圧下またはその近傍の圧力下で処理を被処理物に施すマイクロ波プラズマ処理方法、マイクロ波プラズマ処理装置及びそのプラズマヘッドにおいて、プラズマヘッドにH面スロットアンテナを備え、該スロットアンテナのスロットを $\lambda_g / 2$ のピッチで導波管の中心線を挟んで交互に形成し、かつ、前記スロットから前記プラズマヘッドの放出端までの距離 $n \cdot \lambda_g / 2$ を有するようにする（ここで λ_g ：マイクロ波の管内波長）。また、プラズマヘッドにE面スロットアンテナを備え、該スロットアンテナのスロットを λ_g のピッチで導波管の中心線上に形成し、かつ、前記スロットから前記プラズマヘッドの放出端までの距離 $n \cdot \lambda_g / 2$ を有する均一化線路を配置する。

【選択図】 図6

特願 2003-431939

出願人履歴情報

識別番号 [502266320]

1. 変更年月日 2002年 7月24日

[変更理由] 新規登録

住所 東京都港区赤坂2丁目4番1号 白亞ビル3F
氏名 株式会社フューチャービジョン

特願 2003-431939

出願人履歴情報

識別番号 [000205041]

1. 変更年月日 1990年 8月27日

[変更理由] 新規登録

住所 宮城県仙台市青葉区米ヶ袋2-1-17-301

氏名 大見 忠弘

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/019772

International filing date: 24 December 2004 (24.12.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2003-431939
Filing date: 26 December 2003 (26.12.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 17 February 2005 (17.02.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse